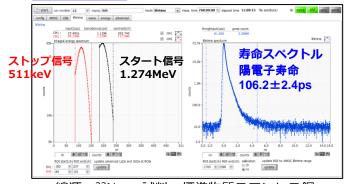
DPALMS-LCA

分子レベルのナノスケール空間構造を解析できる陽電子消滅法の測定に必要な計測・ 電源機器が一つになりました。<mark>寿命測定(Lifetime)</mark>では2台のBaF₂シンチレータから の高速パルス信号を3GspsのADCボードで取り込み寿命時間を算出。コインシデンス <u>ドップラー拡がり測定(CDB)</u>では2台のGe半導体検出器からコインシデンスを取り波 高値から2次元ヒストグラムを生成。さらにこれらの機器の組み合わせにより寿命と運 動量の相関をとるAMOC測定も実現しました。

機能	1.寿命測定 2.シングルスペクトル測定、ドップラー拡がり測定 3.AMOC測定
ADC	2CH 3Gsps 8bit(寿命測定・AMOC測定用) 2CH 100Msps 14bit(ドップラー拡がり測定・AMOC測定用)
時間分解能	< 180ps *検出器による
エネルギー分解能	1.69keV (1.33MeV@ ⁶⁰ Co)
測定時間レンジ	<1100ns(8192ch) ※長寿命測定可
寿命測定	標準物質ステンレス鋼 106.2±2.4 ps 陽電子寿命 標準物質石英ガラス 1.62±0.05 ns o-Ps寿命
高圧電源	2CH: +5000V / CH(Ge半導体検出器用)*プリアンプ電源4系統 2CH: -4000V / CH(光電子増倍管用)
通信I/F	イーサネット, TCP/IP
寸法・重量	170(W)x320(H)x400(D) mm, 約8430g
アプリケーション	データ計測制御用ソフトウェア

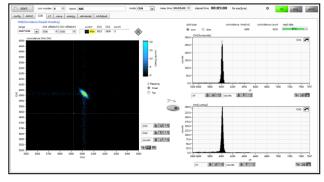


Lifetime

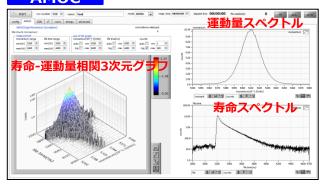


線源:²²Na, 試料:標準物質ステンレス鋼

CDB



AMOC



試料:石英ガラス

設置例



*写真はイメージです。

*記載内容は予告なく変更することがあります。

株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15 TEL:029-350-8011 FAX:029-352-9013

info@techno-ap.com



